

科学分析支援センター 機器分析セミナー

電子顕微鏡で何ができるのか？

科学分析支援センターには多くの電子顕微鏡(走査型(SEM) 4台、透過型(TEM) 2台)が設置されています。これらの装置を教育・研究に有効活用していただくために、装置の原理と基礎、アプリケーションを中心に、X線元素分析装置(EDX)の原理も含めたセミナーを開催いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日時：2012年7月24日(火) 13:00 ~ 16:00

場所：総合研究棟1階 シアター教室

資料：SEMと友だちになろう、TEMと友だちになろう
(日立ハイテクノロジーズ編) 他

* セミナー資料の準備の都合上、事前の参加申し込みをお願いいたします。

● プログラム

時間	講演内容	講演者
13:00 ~ 13:05	センター長挨拶	科学分析支援センター長 小林 秀彦
13:05 ~ 13:45	走査型電子顕微鏡の応用技術 ～SEMで何ができるのか?～ SEMの基礎とアプリケーションデータの紹介	(株)日立ハイテクノロジーズ 中澤 英子 氏
13:45 ~ 14:00	休憩	
14:00 ~ 14:40	透過型電子顕微鏡の応用技術 ～TEMで何ができるのか?～ TEMの基礎とアプリケーションデータの紹介	(株)日立ハイテクノロジーズ 中澤 英子 氏
14:40 ~ 15:00	休憩	
15:00 ~ 15:40	X線元素分析装置の応用技術 ～EDXで何ができるのか?～ EDXの基礎とアプリケーションデータの紹介	ブルカー・エイエックスエス(株) 山崎 巖 氏
15:40 ~ 16:00	質疑応答	

※ セミナー開催の記録のために、写真を撮影させていただきます。
撮影した写真は、必要に応じて報告書等に掲載し公開されることがありますので、予めご承知をお願いします。

セミナーの申し込み & 問い合わせ:

科学分析支援センター (内) 5102・徳永 誠 (toku@mail.saitama-u.ac.jp)